

XP-002193205

AN - 1990-018591 [25]

AP - JP19880127738 19880525

CPY - MATU

DC - G06 L03 M13 T03 V02 W04

FS - CPI;EPI

IC - C01G49/00 ; C23C16/40 ; G11B11/10 ; H01F41/22

MC - G02-A05B G06-C06 G06-D07 G06-E04 G06-F04 L03-B05F M13-G

- T03-D01 V02-H02 W04-D01A

PA - (MATU) MATSUSHITA ELEC IND CO LTD

PN JP1298029 A 19891201 DW199003 008pp

PR - JP19880127738 19880525

XA - C1990-008028

XIC - C01G-049/00 ; C23C-016/40 ; G11B-011/10 ; H01F-041/22

XP - N1990-014215

Ċ

- AB J01298029 The mixed vapour of iron cpd. (1), cobalt cpd. (2), and/or the vapour of the cpd. (3) of the following elements i.e. Cr, Al, Mn, Zn, or Rh, are mixed with oxygen gas and made to decompose in the high density reduced press. plasma (4), and membrane of spinel type iron oxide contg. cobalt is made to form on the base plate by chemical evaporation. (4) comprises high density plasma or high density oxygen plasma generated by electron cyclotron resonance.
 - The iron alloy or iron cpd. contg. cobalt is sputtered on the base plate using alloy or cpd. contg. iron, alloy or cpd. contg. cobalt, and/or alloy or cpd. contg. other elements except iron and cobalt as targets. At the same time the base plate is irradiated with high density plasma generated by electron cyclotron resonance, and the spinel type iron oxide membrane contg. cobalt is made to form the base plate.
 - USE/ADVANTAGE Available for manufacturing photomagnetic high density recording medium that can be reduced with non-contact method. This method utilizes the activity of high density plasma, and is able to mfr. spinel type iron oxide membrane contg. cobalt in which (100) plane of crystals are oriented, and the crystals are made to grow perpendicular to base plate.

AW - PHOTOMAGNETIC

AKW - PHOTOMAGNETIC

- IW PHOTO MAGNETIC RECORD MEDIUM MANUFACTURE DECOMPOSE MIX VAPOUR IRON COMPOUND COBALT COMPOUND FORM SPINEL TYPE OXIDE BASE PLATE
- IKW PHOTO MAGNETIC RECORD MEDIUM MANUFACTURE DECOMPOSE MIX VAPOUR IRON COMPOUND COBALT COMPOUND FORM SPINEL TYPE OXIDE BASE PLATE

NC - 001

OPD - 1988-05-25

ORD - 1989-12-01

PAW - (MATU) MATSUSHITA ELEC IND CO LTD

TI - Photo-magnetic recording medium mfr. - by decomposition of mixed vapour of iron cpd. and cobalt cpd. to form spinel type oxide of base plate

PAT-NO:

JP401298029A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01298029 A

TITLE:

PRODUCTION OF MAGNETO-OPTICAL

RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE:

December 1, 1989

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

FUJII, AKIYUKI TORII, HIDEO AOKI, MASAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP63127738

APPL-DATE:

May 25, 1988

INT-CL (IPC): C01G049/00, C23C016/40 , C23C016/50 ,

G11B011/10 , H01F041/22

US-CL-CURRENT: 252/62.56, 423/594

ABSTRACT:

PURPOSE: To perform high-density and non-contact recording by decomposing an iron compd., a Co compd., and O<SB>2</SB> in highly densified reduced-pressure plasma, and then chemically vapor-depositing the decomposition product on an objective substrate.

CONSTITUTION: The iron compd. [e.g., Fe(C<SB>5</SB>H<SB>7</SB>O<SB>2</SB>)<SB>3</SB>], Co compd. [e.q.,

06/11/2003, EAST Version: 1.04.0000

Co(C<SB>5</SB>H<SB>7</SB>O<SB>2</SB>)<SB>3</SB>], and compd.contg. an element other than the above-mentioned elements [e.g., Cr(C<SB>5</SB>H<SB>7</SB>O<SB>2</SB>)<SB>3</SB>] are respectively charged in vaporizers 7-9, and heated. The vapors are entrained by the carrier qas introduced from a cylinder 10, and introduced into a reaction chamber 1 depressurized by an evacuating system 3. Meanwhile, O<SB>2</SB> is introduced into the chamber 1 from a cylinder 11. A magnetic field is impressed on an electromagnet 5 from a high-frequency power source 6 to produce high-density and reduced-pressure plasma, and spinel oxide contq. Co oriented toward (100) is formed by decomposing. The iron oxide is chemically vapor-deposited on a substrate 4 heated by a heater 12.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio

06/11/2003, EAST Version: 1.04.0000

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-298029

⑤Int. Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号	❸公開	平成1年(1989)12月1日
C 01 G 49/00 C 23 C 16/40 16/50		E -7202-4 G 8722-4 K 8722-4 K		
G 11 B 11/10 H 01 F 41/22		A -7426-5D 7354-5E審査請求	未請求 請	請求項の数 10 (全8頁)

会発明の名称 光磁気記録媒体の製造方法

> 20特 願 昭63-127738

22出 願 昭63(1988)5月25日

⑫発 明 藤 井 映 志 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 @発 明 者 鳥 井 秀 雄 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 @発 明 青木 正 樹 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 勿出 願 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 個代 理 人

弁理士 中尾 敏男 外1名

1、発明の名称 光磁気記録媒体の製造方法

2、特許請求の範囲

- (1) 鉄を含む化合物とコパルトを含む化合物の混 合薦気と酸素、または前記混合薫気にさらに鉄 およびコバルト以外の元素を含む化合物の源気 を加えた混合蒸気と酸素を、磁場を印加するこ とにより高密度化した減圧プラズマ中で分解さ せ、対象基板上にコパルトを含むスピネル型酸 化鉄薄膜を化学蒸着することを特徴とする光磁 気記録媒体の製造方法。
- (2) 電子サイクロトロン共鳴を用いて発生させた 高密度酸素プラズマを利用して、鉄を含む化合 物とコパルトを含む化合物の混合腐気または前 記混合蒸気にさらに鉄およびコパルト以外の元 素を含む化合物の蒸気を加えた混合蒸気を分解 させ、対象基板上にコバルトを含むスピネル型 酸化鉄薄膜を化学蒸着することを特徴とする光 磁気記録媒体の製造方法。
- (3) 電子サイクロトロン共鳴を用いて発生させた 高密度プラズマを利用して、鉄を含む化合物と コパルトを含む化合物の混合蒸気と酸素あるい は前記混合蒸気にさらに飲およびコパルト以外 の元素を含む化合物の腐気を加えた混合蒸気と 酸素を分解させ、対象基板上にコパルトを含む スピネル型酸化鉄彈膜を化学蒸着することを特 徴とする光磁気記録媒体の製造方法。
- (4) 鉄を含む金属又は化合物とコバルトを含む金 **属又は化合物のターゲット、あるいは前記ター** ゲット以外にさらに鉄およびコパルト以外の元 素を含む金属又は化合物のターゲットを用いて、 対象基板上にコパルトを含む鉄合金あるいは鉄 化合物をスパッタリングしながら、電子サイク ロトロン共鳴を用いて発生させた高密度酸素で ラズマを対象基板に照射して、コバルトを含む スピネル型酸化鉄薄膜を形成することを特徴と する光磁気記録媒体の製造方法。
- (5) 鉄を含む化合物が、β-ジケトン系金属指体 またはピスシクロペンタジエニル錯体、また

は金属アルコキシド、または鉄カルボニルであることを特徴とする請求項(I)。(2)。(3)のいずれかに記載の光磁気記録媒体の製造方法。

- (6) コバルトを含む化合物が、βージケトン系金 減錯体、またはピスシクロペンタジェニル錯体、 または金属アルコキシド、であることを特徴と する請求項(1), (2), (3)のいずれかに記載の光磁 気記録媒体の製造方法。
- (7) 鉄およびコバルト以外の元素がクロム、亜鉛、アルミニウム、マンガン、ロジウムであることを特徴とする請求項(1)、(2)、(3)のいずれかに記載の光磁気記録媒体の製造方法。
- (8) 鉄およびコバルト以外の元素を含む化合物が、 8 - ジケトン系金属指体、またはピスシクロペンタジエニル錯体、または金属アルコキシドであることを特徴とする請求項(1)、(2)、(3)、(7)のいずれかに記載の光磁気記録媒体の製造方法。
- (9) プラズマを維持するときの圧力が 1.0 × 10・3
 ~ 1.0 Torr であることを特徴とする請求項(1)
 記載の光磁気記録媒体の製造方法。

で高密度記録を可能にするといった磁気ディスク にない大きな特長をもっている。しかし、光ディ スクメモリーは、磁気ディスクのように書き換え 機能がないといった欠点もある。

審き換え可能だが高密度化に限界があり、接触 に近い状態にある磁気ディスクと高密度化が可能 で非接触方式ではあるが審き換え機能がない光ディスクの利点を兼ね備えた記録方式が光磁気記録 である。 つまり光磁気ディスクメモリーは、高密 度化、審き換え可能な非接触記録方式なのである。

光磁気記録媒体として、代表的なものに希土類金属(G d , T b , D y 他)と遷移金属(F e , C o , N i)とのアモルファス合金膜(R E - T M 膜)がある。R E - T M 膜は、スパッタ法や真空蒸着法などで大面積なものが低温で作製でき、また、大きな垂直磁気異方性ももたせることができ、現在すでに実用化直前まできている。

しかし、上記RE-TM膜は、化学的、熱的に 不安定であり、さらに磁気光学効果(この場合カ ー回転角 0 k)が小さい(8 k が 0.3 ~ 0.4 deg 00 プラズマを維持するときの圧力が 1.0 × 10 6 ~ 1.0 × 1 0 2 Torr であることを特徴とする 請求項(2), (3), (4)のいずれかに記載の光磁気記録媒体の製造方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、高密度、非接触記録を可能とする光 磁気記録媒体の製造方法に関するものである。

従来の技術

現在既に実用化され一般的に普及しているディスクメモリーは、磁気ディスクである。これは、記録、再生、消去が可能であるためさまざまな分野で利用されている。しかし磁気へッドと記録媒体とが接触に近い状態にあるため損傷に対する信頼性に欠け、さらに今後ますます多くなって行くと考えられる情報量を、よりコンパクトに畜えるには、磁気記録方式には限界がある。そこで高密度記録が可能な方式によるメモリー装置の開発が急がれている。

最近急速に発展してきた光ディスクは、非接触

程度)といった欠点がある。これらの欠点に対してはかなり検討されてはいるが、光磁気記録媒体として十分な错特性にはいまだ致ってはいないのが現状である。

上記RB-TM膜に比べ、酸化物系材料は、その熱的、化学的安定性と大きな磁気光学効果をもつ材料として以前から研究されていた。その材料として、ピスマス置換ガーネット膜、コバルトを含むスピネル型酸化鉄膜などがある。

ところがこれらの材料は過去LPE法やCVD 法によって単結晶基板上にしか得られなかったた め、高コスト、基板の種類が限定されていた、な どの大きな障害があった。

優近、ピスマス置換ガーネット膜がスパッタ法によりガラス基板上に得られるようになったが、スパッタ堆積後に高温で熱処理(約500℃以上)しなくてはならない。また、コパルトを含むスピネル型酸化鉄のスパッタ膜にも同様のことが含え

しかし、コパルトを含むスピネル型酸化鉄浮膜

は、フェライトーメッキ法により90で以下の水 溶液中で直接得られており、プラスチックなど耐 熱性のない安価な基板上にも成膜が可能となって きた。

発明が解決しようとする課題

90で以下の低温で作製できるコバルトを含むスピネル型酸化鉄のフェライト・メッキ膜において(100)面に配向した膜が得られないため垂直磁化膜とならない。また上述したように、スパッタ法によればピスマス置換ガーネット膜やコバルトを含むスピネル型酸化鉄膜の垂直磁化膜が得られるのであるが、スパッタ後に高温での熱処理が必要であるため下地基板に制限を受ける。

本発明は上記問題点に指み、光磁気記録媒体として、(100)面に配向したコバルトを含むスピネル型酸化鉄垂直磁化膜を、80℃以下の低温で比較的簡単に製造する方法を提供するものである。

課題を解決するための手段

上記課題を解決するために本発明は、光磁気記

録媒体の製造方法に、磁場により高密度化したマグネトロンプラズマCVD法、ECR(電子サイクロトロン共鳴)プラズマCVD法、ECRプラズマスパッタ法を用いることにより、高密度プラズマの活性さを利用して、80℃以下の低温で(100)に配向したコバルトを含むスピネル型酸化鉄の光磁気記録媒体を比較的簡単に成膜するという構造を備えたものである。

作用

本発明は上記した構成の製造方法であるので、 成膜時の条件を選んでやることにより、直接光磁 気記録媒体である(100)に配向したコバルト を含むスピネル型酸化鉄の垂直磁化膜を、比較的 容易に、耐熱性に乏しい安価な基板に80℃以下 の低温で製造する方法を提供するものである。

実施例

(実施例1)

以下本発明の一実施例のマグネトロンプラズマ CVD法によるコパルトを含むスピネル型酸化鉄 薄膜の製造方法について図面を参照しながら説明

する.

第1図は本発明の一実施例におけるマグネトロンプラズマCVD装置の機略図を示すものである。図において1は反応チャンバー、2は電極、3は反応チャンバー内を低圧に保つための排気系で、4は下地装板、5は磁場印加用の電磁石、6は高周波電源(13.56MHz)、7.8,9は原料の入った気化器で、10はキャリアガスボンベ(N2)、11は反応ガスボンベ(O2)、12は基板加熱ヒーターである。

気化器 7 に鉄(町) アセチルアセトナト
(Fa(Cs H,O₂)s)、8にコバルト(町)
アセチルアセトナト(Co(Cs H,O₂)s)、
9にクロム(町) アセチルアセトナト
(Cr(Cs H,O₂)s)、を入れ、それぞれ
130℃、110℃、110℃に加熱し、その蒸
気を窒素キャリア(流量 2 SCCM)とともに排
気系 3 により被圧された反応チャンパー1 内に導
入する。同時に反応ガスである酸素(5 SCCM)

も導入し、電磁石5より磁場(540G)を印加

してプラズマを発生(電力 0.1 W / cml)させ、 2 0 分間減圧下(1.0 × 1 0 ° Torr)で反応を

行ない、70℃に加熱したガラス基板上に成膜した。得られた膜を解析すると、組成が

CoCrFeO。でスピネル型の結晶構造をしており、(100)面に配向していた。VSMにより磁気特性を測定した結果垂直方向のHc=24KOe。Ms=180emu/cc、角形比0.96であった。またSEMにより酸構造を観察するとコラム径400人、腹厚8000人であり、さらにファラデー回転角を測定したところ波長780nm(LD)で3.2×104deg/cmであった。

次に、上記成膜条件で下地落板に3.5インチ径ポリカーボネート光磁気ディスク落板を用いてCoCrFeO。膜を堆積させた後CoCrFeO。膜上に反射膜(Cr:100nm)をスパッタで作製し、ディスク構造として、記録光源にLDを用い記録パワー5mW、再生パワー2mW、記録周波数0.5Mh、線速度2.5m/sにおいて記録再生を行なった結果C/N値は51dBであった。

以下同様にして、他の金属化合物を用いた場合 についての結果を上記結果と合わせて第1表に示す。

(以 下 余 白)

		_	•				~		8									
		6	Н, О,	H, 0,	H, 0,	H, 0,	H, 0,		1, 0,	N \ O	(gp)	5 1	4 5	5 0	4 8	s 0	4 6	4 7
		文元	Cr (C, 1	A & (Cs)	Mn (Cs F	Rh (Cs H	(C, F	'	Cr (C, H,									
	証	_	C r	9 Y	z X	Rh	u Z	L	ر د	五角	_	_				_		
		&	0,0				02)8			ファラデー回転角	(deg / cm)	32×10	29×10	30×10	2.6 × 1.0 4	2.7×10	8 × 1 0	3×10
榖	壓		H,	•	H 5) 1	•	Н,		,	715	₽	3 2	2.9	0 ج 0	2.6	2.7	8 8	3.3
無	张	文元	5) 0)		5 O)		5) O)						_					
\$13K	扣		0 0		° C		၁			ŧ			,		0	0.		
		7	0, 1,					° (T		10	F e 1. 3	0	F e 1. 3	F e		70
		化器	5 H 1 O 2	,	•	H S	•	e (OC, Hs	0) \$	•		(F)	A & s	e e		Z n	6,0	r Fe (
		跃	٥			و (C و			(CO)	_		COCT	COA	CoMnF	CoRh,	C 0 2	COF	0 0
ļ	戴	幸 幸	(E.			(£.		<u>(e.</u>	GE.	Į.	中		_		_	-	-	\dashv
	並	軸	_	7	<u></u>	_	2	9	-	瓦瓦	物中	_	2	ຕ	4	ر ا ۍ	9	_

下地基板としてガラス, ポリカーボネート以外に S l (l l l l). S i (l 0 0), サファイヤ R 面. サファイヤ C 面. ポリイミドを用いて成膜した場合についても (l 0 0) に配向したコバルトを含む酸化鉄薄膜が生成した。つまり、

(100)配向性は下地基板の影響を受けなかった。

また、プラズマ中に磁場を印加することにより 印加しない場合と比べて、低プラズマ電力で高速 堆積も可能となると言った利点もある。

なお、特許請求の範囲において、プラズマを維持する時の圧力が1.0×10°~1.0 Torr としたのは、1.0 Torr 以上だと化学蒸着の際プラズマが有効に効かないため低温でコバルトを含むスピネル型酸化鉄薄膜が得られないためである。また1.0×10° Torr 以下だと成膜速度が非常に遅くなってしまうからである。

(実施例2)

以下本発明の一実箱例のECRプラズマCVD 法によるコパルトを含むスピネル型酸化鉄環膜の 製造方法について図面を参照しながら説明する。

第2 図はBCRブラズマCVD装置の機略図を示している。図において21 はBCRの高密度プラズマを発生させるためのプラズマ室、22は電子サイクロトロン共鳴に必要な磁場を供給する電磁石であり、23 は反応室、24 はマイクロ液(245 CH) 導入口、25 はブラズマ源となるがス(酸素)の導入口、26 は下地基板、27 は基板ホルダーで冷却水により常に基板を一定温度に保てるようになっている。28、29、30 は原料の入った気化器で、31 はキャリアガス

(N₂) 導入口である。32 は反応室を強制排気 するためのポンプ (油回転ポンプおよびターポ分 子ポンプ) につながっている排気口である。

まずプラズマ室 2 1 および反応室 1 3 内を 1.0 × 1 0 * Torr まで波圧して吸着ガス等を除去する。次にプラズマ室 2 1 に導入口 2 5 からプラズマ源となる酸素 (流量 2 0 S C C M) を導入し、導入口 2 4 より 2.4 5 C Hz のマイクロ波を 4 0 0 W 印加して、電磁石により磁界強度を 8 7 5 ガウ

スとすることによりECRブラズマを発生させる。その際、電磁石22による発散磁界により、発生したブラズマはブラズマ室21より反応室23に引き出される。また、気化器28、29、30にそれぞれ、鉄アセチルアセトナト、コバルトアセチルアセトナト、クロムアセチルアセトナトを入れておき、130℃、110℃、110℃に加熱し、その蒸気を窒素キャリア(波量それぞれ2SCCM)とともに反応室23内に導入する。 海入された蒸気を反応室21内より引き出された 活性なプラズマに触れさせることにより、30分間反応を行ない、ガラス基板16上に成膜した。

なお成膜時の基板温度は 4 0 ℃で一定であった。 また成膜時の真空度は 1.0 × 1 0 ← Torr であった。

得られた膜を解析した結果、膜組成 C o C r e. a F e i. z O a で (100) 面に配向 したスピネル型の結晶構造をしており、コラム径 3 2 0 人、膜厚は5 0 0 0 人であった。またファ ラデー回転角は、7 8 0 n m の波長において 3.5×10 4 deg/cmであり、垂直方向のHc‐・ 2.2 KOe、Ms = 160 emu/cc、角形比0.97 であった。

次に、マグネトロンプラズマCVD法での生成 膜(実施例I)と同様に、光磁気特性を調べたと ころC/N値は52dBであった。

以下同様にして他の金属化合物を用いた場合に ついての結果を上記結果と合わせて第2 衷に示す。

(以下余白)

		気代 数30	(C, H, O,)	1	(C, H, O,)	(C, H, O,)	n (C, H, O,)	(C, H,	Ē	N/O	(RP)	5.2	5.0	4 8	5.1	6 4	5 0	5 0
	-		S		Z	~	u 2	AR	r O	無								
2 独	免原料	気 化器 2 9	C. H, O.)			0 (C, H,),	•	Cs H, O,) s		ファラデー回転角	(deg / cm)	3.5 × 1.0 4	3.7 × 1.0	32×10	30×10	31×10	32×104	3.6 × 10 •
踩	33	区	C 0 (C g) °)		50) 00				,0			,0		0.	
		気化器28	Fe (C, H, O,)			Fe(C, H,)		Fe (OC, H,),	Fe(CO),	\$2 \$2	1	CoCr. Fel.	CoFerOa	CoMnFeO	CoRhe. Fei.	CoZnFeO	C . A F e	CoCrFeO,
	# #	草	-	1 2	1 3	-	- 5	9 -	-	च *	4	-	1 2	1 3	7	1 5	- 1	1

8 2 5 6 6

(実施例3)

以下本発明の一実施例のECRプラズマCVD 法によるコバルトを含むスピネル型酸化飲譲渡の 製造方法について図面を参照しながら説明する。

第2図において、実施例2ではキャリアガスとして窒素を用いプラズマ源となるガスとして酸素を用いたが、今回は、キャリアガスに反応ガスである酸素を用い、液量を気化器28,29,30に対してそれぞれ同様に4SCCMとし、プラズマ源として窒素を用いて(流量20SCCM)導入口25から導入し、他は実施例2の場合と同様に成膜した。

生成膜の光磁気特性を第3表に示す。

(以下 余白)

0:0 0 0 0 0 **.** 0 N/O (BP) 2 0 8 S 0 m Н Н, S н Rh (C, H, Ξ ₹ 4 5 × (C s (C s ် (၁ ر د د يد 区 ပ Σ 2 < Ü ラデー回転角 可 8 00 0,0 × × 0 胀 匮 H 5 2 E F N 77. ಣ က યાલ H 1 K H 3 ပ် (၁ ပီ () ر د د £ SK! ು ပ 烁 ပ ů 00 0 Ħ o 0 臣 6 . 3 -... 0,0 œ ¥ # Œ, Œ. Œ Œ, \circ 0 ъ. т u -: Ŧ E 113 ပီ COARF • 6 Ω. ပ် (၂) ້ນ () ŧ 0 F 0) ပ Σ ပ œ 7 ပ ⋉ ٥ ပိ e ပ U ပ ပ ပ te. fæ. **E** 4 过客口 m ഹ မ ~ 故器以中 20 8 9 -N 2 ~ 8 ~ N N ~ ~ N ~

なお、プラズマ源となるガスを窒素以外のガス (例えばアルゴン、NHa)等に変化させた場合 も同様に良い光磁気特性を示すコバルトを含むス ピネル型酸化鉄膜が得られた。

(実施例4)

以下本発明の一実施例のECRブラズマスパッタ法によるコバルトを含むスピネル型酸化鉄薄膜の製造方法について図面を参照しながら説明する。

第3図はBCRブラズマスパッタリング装置の 概略図を示している。 図において41は高密度ブラズマを発生させるためのブラズマ室、42は電子サイクロトロン共鳴に必要な磁場を供給する電 (2.45 Clu) 導入口、45はブラズマ源となるがス、46はスパッタ電源、47はターゲット、48は下地装板、49は基板ホルダー、50は欠 が ま は 下地装板、49は基板ホルダー、50は 反応室を強制排気するためのポンプ (油回転ポンプ) につながっている排気 およびターポ分子ポンプ) につながっている排気 しである。また51は、酸素導入口である。

まずプラズマ室41および反応室43内を

1.0×10 ⁴ Torr、まで減圧して吸着ガス等を除 去する。次にプラズマ室41に導入口45からブ ラズマ源となるアルゴン(流量20SCCM)お よび酸素(流量5SCCM)を導入し、導入口 4 4 より 2. 4 5 C Hzのマイクロ波を 6 0 0 W 印加 して、電磁石により磁界強度を875ガウスとす ることによってECRプラズマを発生させ、電磁 石42による発散磁界により反応室43に引き出 される。ターゲット47として鉄、コパルト、ク ロムを用意しておき、スパッタ電源に400W印 加することによりスパッタし、導入口51より導 入した酸素とともにECR特有の基板上でのイオ ン衝撃効果により下地基板48上にコパルトを含 むスピネル型酸化鉄薄膜を30分間成膜した。な お、成膜時の真空度は2.5×10 Torr であっ た。また基板温度は、成膜の間60℃で一定であ った。

得られた腹を解析した結果、膜組成 CoCrPeO。で、(100)面に配向したスピネル型の結晶構造をしており、柱状構造をして いた。コラム径は3 7 0 人、膜厚は7 5 0 0 人であった。またファラデー回転角は、7 8 0 n mの波長において3.3 × 1 0 4 deg/cmであり、垂直方向のH c = 2.4 K O e 、M s = 1 7 2 emu/cc、所形比0.9 8 であった。

次に、実施例 1. 2. 3 と同様に、光磁気特性 を調べたところ C / N値は 5 0 d B であった。

以下同様にして、他のターゲットを用いた場合 についての結果の一例を上記結果と合わせて第4 衷に示す。

(以下余白)

			٠			7.0	0 4	3 .	
第 4 表		9 1 4 "	0 3			*			
			av L	Ł	br.	*			
	¥	梅中	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	

1			
H H	£ 2	ファラデー回転角	N/O
华	į	(deg/cm)	(48)
4 1	CoCrFeO	3.3 × 1.0 4	5.0
4 2	CoMno. · Fei. O.	3.0 × 1.0 t	
4.3	CoRhFeO,	3 1 × 1 0 4	0 0
4 4	C o Z n + F e 1. O.	3 3 × 1 0 4	0 0
4.5	C o A 2 , F e 3 O.	3.2 × 1.0 4	2 -
4 6	CoFegO	* C - X 5 6	7 7
			7

低波しているからである。

発明の効果

以上延べてきたように本発明は、高密度プラズマの活性さを利用した成膜方法であるため、80 で以下の低温で直接(100)面に配向し下地基 仮に対して垂直方向に柱状成長したコバルトを含むスピネル型酸化鉄薄膜を合成できる製造方法であり、光磁気記録の分野においてきわめて有益な発明である。

4、図面の簡単な説明

第1 図は、本発明の一実施例におけるマグネトロンプラズマ C V D 装置の機略図、第2 図は本発明の一実施例における E C R プラズマ C V D 装置の機略図、第3 図は本発明の一実施例における E C R プラズマスパックリング装置の機略図である。

| 1 ····· 反応チャンバー、 2 ····・ 電極、 3 ····・ 排 気系、 4 ····・下地基板、 5 ····・・電磁石、 6 ····・ 高 周波電源、 7 · 8 · 9 ····· 気化器、 1 0 ····・キャ リアガスポンベ、 1 1 ····・ 反応ガスポンベ、 1 2 なお、ターゲットに鉄やコバルトを含む化合物を用いたり、プラズマ源のガスとして、上記ガス以外のものを用いた場合についても、他の条件を選んでやることにより、数4に示した程度の光磁気特性を示す生成膜が得られた。

また、特許請求の範囲請求項(2). (3). (4)において、プラズマを維持する時の圧力を1.0×10* ~1.0×10* Torr としたのは、1×10* 以下だと反応生成物の成膜速度が遅く実用上問題があるためであり、1×10* Torr 以上だとプラズマが有効に効かないためである。

表1. 表2. 表3. 表4より、光磁気記録媒体の製造方法として、マグネトロンプラズマCVD法およびECRプラズマCVD法およびECRプラズマスパッタ法が非常に有効な方法であることがわかる。これは、上記製造方法で成膜を行なった場合生成膜が下地基板に対して垂直方向に(100)に配向した柱状構造を有し、かつ低温で成膜することからそのコラム後が300~450人程度と小さいことにより、媒体ノイズが

…… 基板加熱ヒーター、21 …… ブラズマ室、22 …… 電磁石、23 …… 反応室、24 …… マイクロ波(2.45 C lb) 導入口、25 …… ブラズマ ではとなるガスの導入口、26 …… 下地基板、27 …… 基板ホルダー、28.29.30 …… 気化器、31 …… キャリアガス導入口、32 …… 排気口、41 …… ブラズマ室、42 …… 電磁石、43 …… 反応室、44 …… マイクロ波(2.45 G lb) 導入口、45 …… ブラズマ源となるガスの導入口、46 …… スパッタ電源、47 …… ターゲット、48 …… 下地基板、49 …… 基板ホルダー、50 …… 排気口、51 …… 酸素導入口。

代理人の氏名 弁理士 中尾敏男 ほか 1名



